

집속된 광분해 이소레이저에 의한 플라즈마로부터 방출되는  
연속 X-선 스펙트럼 분석과 전자온도 결정

Analysis of Continuum X-Ray Spectrum and Determination of Electron  
Temperature from Iodine Photodissociation Laser Produced Plasma

김 동 환, 김 남 성, 이 상 수  
한국 과학 기술원 물리학과

ABSTRACT

1-GW Iodine Photodissociation Laser ( $\lambda=1.315\mu\text{m}$ ) is focused to generate the continuum X-ray radiation at titanium( $Z=22$ ) target. A piece of aluminum(360Å)-mylar( $8\mu\text{m}$ ) film is used to isolate the soft X-ray radiation emitted. Convex-curved mica crystal spectrometer is used to obtain the soft X-ray spectra from the laser titanium target plasma and the slope of continuum X-ray spectra are found to show two different electron effective temperatures, 0.11KeV and 7.1KeV. We compare the two temperature result with the foil absorption method.

1. 서 론

고출력 레이저 광속을 촛점으로 집속시킴으로써 촛점에 이루어지는 높은 전기장의 세기로 말미암아 고온, 고밀도의 플라즈마가 형성된다. 본 연구에서 사용한 집속된 레이저 출력  $1.2 \times 10^3 \text{ W/cm}^2$ 에 대해 형성되는 전기장의 세기와 광압은 각각  $7.0 \times 10^7 (\text{V/cm})$ ,  $4.3 \times 10^3 \text{ atm}$ 이다. 이와 같이 강한 전기장과 광압은 레이저 플라즈마의 여러가지 복잡한 비선형 현상을의 원인이 된다.

레이저 플라즈마의 형성 초기 단계는 금속 원자의 이온화로 말미암아 발생된 자유전자들이 집속된 레이저 빔의 강한 전기장에 의해 가속된 후 주위의 중성 원자나 이온들과 충돌하여 연쇄적인 이온화를 일으킨다. 이 때의 플라즈마는 inverse bremsstrahlung 과정에 의해 레이저 에너지를 흡

수한다[1].

이와 같이 높은 온도로 가열된 레이저 플라즈마로부터 방출되는 전자기 복사는 전자의 궤도 변화의 종류에 따라 크게 세가지로 나뉘어진다. 즉 전자의 구속된 에너지 준위사이에서의 속박-속박 천이에 의한 선스펙트럼과 자유전자의 자유-속박 천이에 의한 재결합 복사, 자유-자유 천이에 의한 bremsstrahlung 복사가 있다.

플라즈마 내부상태는 고온, 고밀도이므로 플라즈마로부터 방출되는 스펙트럼은 주로 soft X-선 영역에 분포되기 때문에, 플라즈마 내부 온도는 soft X-선 영역의 연속 스펙트럼의 기울기나 foil-absorption 방법[2] 등으로 측정한다.

본 논문에서는 soft X-선 영역에서 연속 스펙트럼의 기울기 측정에 의한 전자온도 결정과 foil absorption 방법에 의한 전자온도 결정 방법을 논하고 각각의 결과를 비교하였다.

## 2. X-선 필름을 이용한 레이저 플라즈마의 연속 스펙트럼 기록과 전자 온도 결정

플라즈마로부터 방출되는 연속 스펙트럼의 단위 입체각당 방출되는 X-선의 광원 세기  $W(E)dE$  와 흡수계수가  $\mu(E)$  이고 두께가  $t$ 인 X-선 필터를 통과한 뒤의 세기  $S(E)dE$  는 다음과 같다.

$$S(E)dE = \Omega W(E) e^{-\mu(E)t} dE \quad (2-1)$$

$$W(E)dE = AT_e^{-1/2} e^{-E/T_e} dE \quad [\text{erg}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{sterad}^{-1}] \quad (2-2)$$

여기서  $T_e$ 는 전자 온도 [eV]이며 A는 cgs 단위로 표현할때 다음과 같다.

$$A = 7.58 \times 10^{-15} \times n_e^2 \cdot V \cdot \left\{ \sum_p f_p Z_p^2 + \sum_p f_p (\chi_H/T_e) \cdot \sum (\chi_{p,n}/\chi_H)^2 \right. \\ \left. \times (\xi_n/n) e^{\chi_{p,n}/T_e} \right\} \quad (2-3)$$

따라서, ( 2-2 ) 식에서

$$\ln[W(E)] = C_1 - E/T_e, \quad C_1 = \ln[A T_e^{-1/2}] \quad ( 2-4 )$$

이므로, 플라즈마의 X-선 광자 에너지와 광원의 스펙트럼 세기와의 semi-log 관계에서  $\ln[W(E)]$  와 광자 에너지와는  $(-1/T_e)$  의 기울기를 가지는 직선 관계식이 존재한다.

따라서 레이저 플라즈마의 스펙트럼을 얻으면 광자 에너지와의 관계식으로부터 플라즈마의 전자 온도를 결정할 수 있다.

( 2-1 ) 식과 ( 2-2 ) 식에서;

$$S(E) = \Omega W(E) \cdot T(E) \quad ( 2-5 )$$

의 관계가 있으므로  $W(E)$ 는 X-선 필름에 노출된 연속 스펙트럼의 세기  $S(E)$ 를 X-선 필터의 투과도  $T(E) [= \exp(-E/T_e)]$ 로 나누어 주면 얻어질 수 있다. 여기서  $W(E)$ 는 절대적인 세기는 필요치 않으며 단지 상대적인 세기의 크기만 알면 된다.

일반적으로 X-선 필름에 기록된 스펙트럼의 투과도  $T_f$ 로부터  $S(E)$ 를 알려면 X-선 필름의 파장에 따른 감마 ( $\gamma$ ) 값을 알아야 하며, 이는 X-선 필터의 두께에 따른 필름의 노출 변화량으로부터 다음과 같이 표현된다.

$$S(E) = A \cdot T_f^{-1/\gamma} \quad ( 2-6 )$$

$$\gamma = |D_n - D_{n-1}| / |\log(E_n) - \log(E_{n-1})| \quad ( 2-7 )$$

여기서  $D_n$ 은 X-선 필터  $n$ 장을 투과한 뒤 현상된 X-선 필름의 photgraphic density로서  $D_n = \log(1/T_f, n)$ 이다. 그런데, ( 2-6 )식에서 X-선 광자 에너지에 따른  $D_n$ 은 측정이 실험적으로 매우 어려우며, X-선 필터에 의한 투과 대역폭이 비교적 좁은 영역 ( $0 < \lambda < 20 \text{ \AA}$ ) 이므로 레이저 플라즈마 광원의 광자 에너지에 대해 적분된 세기로 근사하였다. 그림(1)의 실험 결과에서  $[D_n - D_{n-1}] = \log(T_f, n / T_f, n-1)$  이 0.185로 거의 일정한 값을 가지므로 ( 2-6 )에서 X-선 필름의 감마값은 다음과 같다.

$$\gamma(E) = \frac{0.185}{|\log(E_n/E_{n-1})|} \quad (2-8)$$

그런데 입사 에너지의 시간폭을  $\tau$  라 할때,

$$\log(E_n) = \log[S(E) \cdot \exp(-\alpha_E \cdot n) \cdot \tau] \quad (2-9)$$

이므로, (2-7)식은

$$\gamma(E) = \frac{\log(T_{f,n}/T_{f,n-1})}{0.434 \cdot \alpha_\lambda} \quad (2-10)$$

이다.

따라서, 레이저 플라즈마의 광원 세기와는 X-선 광자와의 관계 (2-4), (2-5), (2-10)식으로부터 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \ln[W(\nu)] &= \ln[A \cdot T_f^{-1/\gamma} \cdot \exp(\alpha_E)] \\ &= C_1 - h\nu/T_e \\ , \quad \gamma(E) &= \log(T_{f,n}/T_{f,n-1}) / (0.434 \cdot \alpha_\lambda) \end{aligned} \quad (2-11)$$

### 3. Foil Absorption 방법에 의한 플라즈마 온도 측정

JAHODA, et al.(1960)에 의해 처음으로 플라즈마 온도를 결정하는데 사용한 Foil Absorption 방법은 근본적으로 플라즈마의 스펙트럼이 연속스펙트럼만 가짐을 가정한 뒤에 이루어지는 방법이며 X-선 필터로 사용되는 금 속 포일(Be, Al, ...)의 두께와 흡수계수의 변화에 의해 필터를 투과한 X-선 세기의 상대적 크기의 비율에서 플라즈마 온도를 결정한다. [2] 일반적으로 금속 포일의 X-선 흡수 계수는 지수법칙에 의해

$$\mu(E) = aE^{-n}, \quad E_u > E > E_L \quad (3-1)$$

로 표현되며 (2-1) 식에서, 측정되는 전체 X-선 세기는 다음과 같다.

$$S(E_C) = A\Omega T_e^{-1/2} \int_0^\infty \exp(-E/T_e - atE^{-n}) dE \quad (3-2)$$

X-선 필터의 cutoff 광자 에너지를  $E_c$ 로 정의하면  $E_c = (at)^{**}(1/n)$ 로 표현된다. 따라서 (3-2) 식은

$$S(E_C) = A\Omega T_e^{-1/2} \int_0^\infty \exp \left\{ -(E/T_e) - (E_c/E)^n \right\} dE \quad (3-3)$$

이며, 위 적분은  $E=0$ 에서 특이점을 가지므로  $\int \ll \int$  을 만족하는  $\epsilon$ 을 택해 적분한다.  $\epsilon$ 은  $T_e < E_c$  이면  $T_e/2$ 로,  $T_e > E_c$  이면  $E_c/2$ 로 택한다. (3) 본 연구에서는 X-선 필터의 두께를 장수를 변화시켜 조절하였으므로 1장을 투과한 X-선 세기를 기준으로 각 장에 대해 상대적인 값을 측정하였다. 따라서 (3-3)식에서 N 장에 대한 X-선 세기의 상대적 크기  $R(N)$ 은 다음과 같다.

$$R(N) = \frac{\int_\epsilon^\infty \exp \left\{ -(E/T_e) - (EC(N)/E)^n \right\} dE}{\int_\epsilon^\infty \exp \left\{ -(E/T_e) - (EC(1)/E)^n \right\} dE} \quad (3-4)$$

측정된 상대적 X-선 세기를  $D(N)$ 이라 두면 플라즈마 온도는  $\Sigma (R(N) - D(N))^2 = \text{Minimum}$  이 되는  $T_e$ 를 구하면 된다.

따라서 플라즈마 온도를 구하는 문제는 비선형 least square 방법으로 귀착된다. 즉,

$$\frac{\partial}{\partial T_e} \sum_N \left[ R(N, T_e) - D(N) \right]^2 = 0 \quad (3-5)$$

(3-4) 은  $T_e$ 의 비선형 방정식이 되므로 직접 푸는 방법은 없고  $T_e$ 를

반복 계산에 의해  $\Sigma (R(N, Te) - D(N))^2$  이 최소가 되는  $Te$ 를 찾아야 한다.  $Te$ 를 찾기 위해 반복 계산중  $Te + \Delta \rightarrow Te$  에서 증가분  $\Delta$ 는 (3-4) 식에서 다음과 같다.

$$\Delta = \frac{\sum_{j=1}^N [D_j - R_j^0(T_e)] \cdot \left(\frac{\partial R_j}{\partial T_e}\right)_0}{\sum_{j=1}^N \left(\frac{\partial R_j}{\partial T_e}\right)_0^2} \quad (3-6)$$

그림 5에서 Ti( $Z=22$ )에 대한 X-선 필터의 장수변화에 따른 X-선 세기 비율을 비선형 least square 방법으로 추적하여  $Te = 3.27$  [KeV] 을 얻었으며 이때 least square error는  $\Sigma \delta^2 = 8.88 \times 10^{-3}$  이다.

Foil Absorption 방법은 다중 온도를 갖는 플라즈마 온도 측정에도 응용 시킬수 있다. 만일 레이저 플라즈마내의 전자들이 Maxwell 속도 분포를 하지 않는 경우 이때는 단일 플라즈마 온도는 정의될수 없으며 X-선 스펙트럼은 다중 온도에 의한 스펙트럼들의 중첩으로 생각하여 여러개의 변수를 가지는 비선형 least square 방법으로 접근할수 있다.

다중 온도를 가지는 경우 상대적인 X-선 세기는,

$$R_i = \frac{\sum_q A_q T_q^{-1/2} \int_E^\infty \exp \left\{ -(E/T_e) - (EC(N)/E)^n \right\} dE}{\sum_q A_q T_q^{-1/2} \int_E^\infty \exp \left\{ -(E/T_q) - (EC(1)/E)^n \right\} dE} \quad (3-7)$$

이다.

여기서  $Aq$ 는  $Tq$ 와 마찬가지로 결정하여야 할 독립 변수로 취급하면 ( $Aq$ ,  $Tq$ )는 least square 조건에서

$$\frac{\partial}{\partial \beta_q} \sum_i \left( R_i(\beta_q) - D_i \right)^2 = 0 \quad (3-8)$$

여기서  $\beta_q = A_1, A_2, \dots, T_1, T_2, \dots$  을 나타낸다.

와 마찬가지로, 각 성분의 증가분  $\Delta$ 는 다음과 같다.

$$\sum_{i=1} \Delta_i \left\{ \sum_{j=1} \left( \frac{\partial R}{\partial \beta_i} \right)_0 \cdot \left( \frac{\partial R}{\partial \beta_k} \right) \right\} = \sum_{j=1} [D_j - R_j^0] \cdot \left( \frac{\partial R}{\partial \beta_k} \right) \quad (3-9)$$

따라서 (3-8)은 N 차 행렬 방정식과 같다. 즉,  $A \cdot X = B$  의 해  $X$ 로부터  $A_1 = A_1 + \Delta_1$ ,  $A_2 = A_2 + \Delta_2$ , ...,  $T_1 = T_1 + \Delta_1$ , ... 로 반복 계산하여 다중 플라즈마 온도  $T_i$  ( $i=1, 2, \dots$ ) 를 구할 수 있다. 그림 6에서 두 전자 온도 ( $T_1, T_2$ ) 를 가정하고 상대적인 X-선 세기 비율에 적용하였다.

두 전자 온도 가정에 의한 least square fitting 결과에서  $T_1 = 0.11$  [KeV],  $T_2 = 7.0$  [KeV]이며, 단일 전자 온도에 비해 보다 더 적은 least square error 를 주므로 제2장에서 논의한 X-선 스펙트럼의 두 기울기 (두 전자 온도) 결과를 지지해 준다.

#### 4. 결 론

$Ti(Z=22)$  레이저 플라즈마 온도를 X-선 연속 스펙트럼에 의한 측정 방법과 Foil Absorption 방법에 의한 측정을 비교하고, 레이저 플라즈마의 전자 온도가 두개가 존재함을 두 결과 분석에서 보았다.

이는 플라즈마 내에서 레이저 에너지 흡수에 비선형 효과가 있음을 나타내 주며, 두 가지 성분의 전자 집단이 존재함을 시사한다.

일반적으로 플라즈마는 온도와 밀도 조건에 따라 충돌 현상 (collision dominative)과 집단 현상 (collective behavior)을 동시에 가지므로 [4] 입사 레이저 에너지 세기의 변화에 따른 온도 변화를 측정하면 플라즈마의 레이저 에너지 흡수 기구에 대해 많은 정보를 얻을 것으로 기대된다.

#### REFERENCES

- [1] H.Motz, 'The Physics of Laser Fusion', (Academic Press, London, 1979)  
pp.120-144.
- [2] F.C.Jahoda, et al., Phys.Rev., Vol.119, 843(1960).
- [3] Tt.P.Donaldson, Plasma Physics, Vol.20, 1279(1978).
- [4] C.Yamanaka, et al., Phys.Rev.A6, 2335(1972).

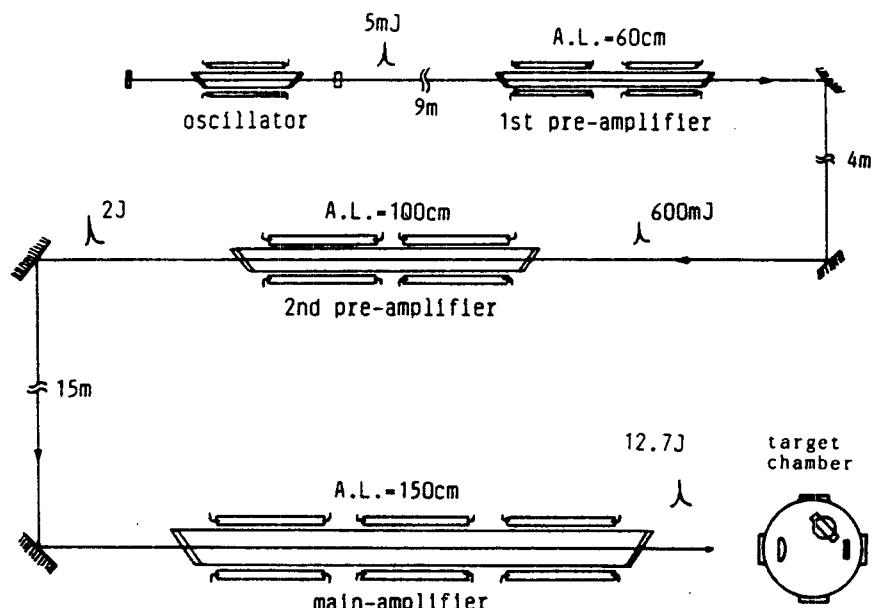


Fig.1 Schematic diagram of iodine photodissociation laser and target chamber. The target chamber includes focusing lens ( $F/2$ ), titanium target and mica crystal spectrometer for X-ray diagnostics.

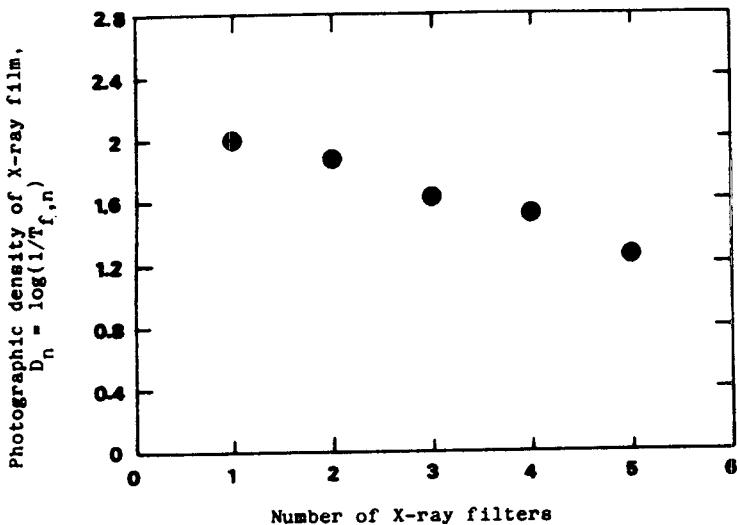


Fig.2 The measured Photographic density of X-ray film vs. number of X-ray filters [mylar(8um)+Al(360A)] for radiation from laser Ti ( $Z=22$ ) target plasma.

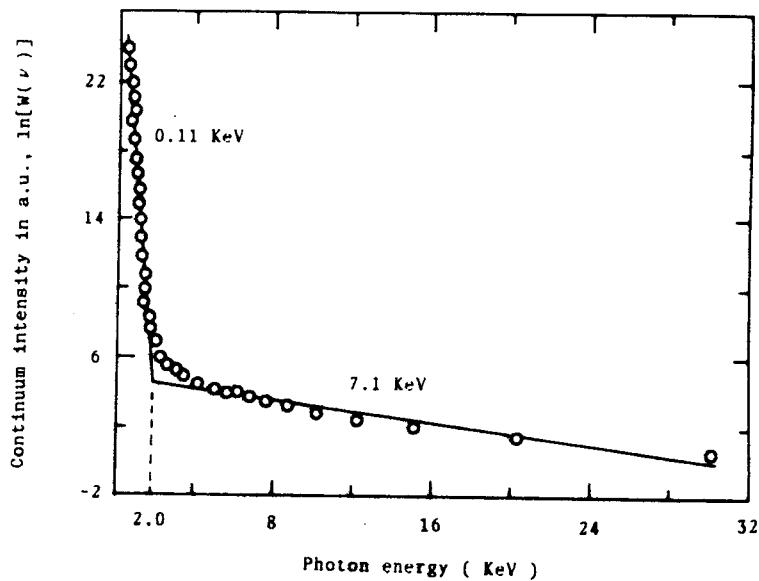


Fig.3 Two slopes give electron temperatures, 0.11 KeV and 7.1 KeV for laser Ti ( $Z=22$ ) target plasma.

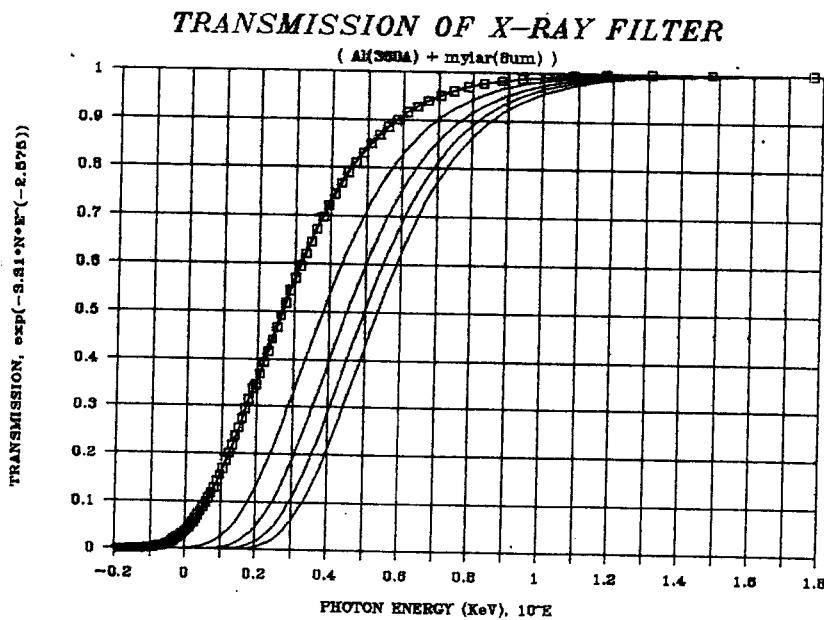


Fig.4 Transmission of X-ray according to the number of filters vs. X-ray energy.

### ESTIMATION OF PLASMA TEMPERATURE ( Ti(Z=22) TARGET )

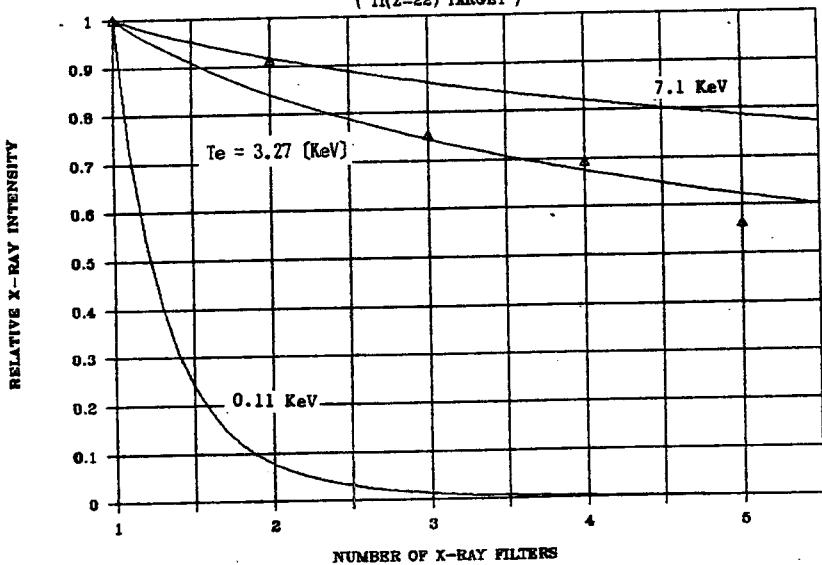


Fig.5 Relative X-ray intensity transmitted through different foil thickness (number of X-ray filters) assumed single plasma temperature.

### ESTIMATION OF TWO TEMPERATURES ( Ti(Z=22) TARGET )

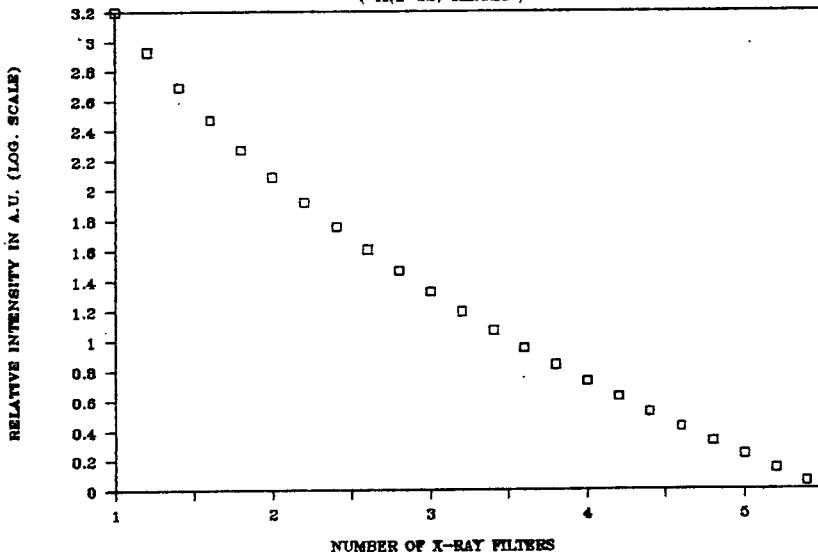


Fig.6 Theoretical relative X-ray intensity transmitted through different foil thickness assumed two temperatures (  $T_1 = 0.11$  KeV,  $T_2 = 7.0$  KeV ).